文章编号: 0253-2239(2010)09-2646-06

极紫外光谱仪光学系统的优化设计

₹ 挺 占丽军

(上海大学精密机械系,上海 200072)

摘要 将平面对称光学系统的像差理论应用于极紫外(XUV)光栅仪器的评价函数,可以得到评价函数关于光学参量的解析表达式。应用合作型协同进化遗传算法来解决多参量评价函数的优化问题,建立了优化程序。应用该程序对 XUV 摄谱仪系统进行优化设计,并运用光线追迹程序 Shadow 对该光学系统进行数值成像计算和比较,研究结果表明发展的评价函数在 XUV 多元件光栅光学系统优化设计中是十分有效的。
关键词 光学设计;评价函数;像差;优化设计
中图分类号 TH744.1 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20103009.2646

Optimization of Optical System of Extreme Ultra-Violet Spectrometer

Xu Ting Lü Lijun

(Department of Precision Mechanism, Shanghai University, Shanghai 200072, China)

Abstract The aberration theory of plane-symmetric optical systems recently developed is applied to the merit function of extreme ultra-violet (XUV) grating instrument defined; consequently the merit function can be expressed as a function of optical parameters. This merit function of multiple parameters is optimized with the cooperative coevolutionary genetic algorithms. The optimization program is set up, which is then used to optimize a XUV flat-field spectrograph system; the ray tracing calculations to the optical system are made with the program Shadow. The imaging calculations show that the merit function is a very useful means to optimize the XUV multi-element grating instruments.

Key words optical design; merit function; aberration; design optimization

1 引 言

在软 X 射线、真空极紫外(XUV)光谱仪系统 中,通常采用反射镜和光栅元件;光学系统一般是具 有平面对称的。目前,利用评价函数对此类系统开 展优化设计的工作很少。其主要原因:1)在 XUV 波段光学元件的传输效率一般比较低,且装置比较 复杂、昂贵,这对光学元件数目的限制使得它很难实 现像常规透镜系统那样自动化设计;2)人们大多应 用基于光程函数发展的像差理论^[1],这个理论本质 上仅适用于单元件系统,而且它的像差表达式仅仅 在光线的衍射角等于零、且像平面位于系统的子午、 弧矢的重合焦平面上才是精确的。另一种像差分析 途径是光线追迹解析法^[2],虽然它的像差表达式是 精确的,但表达式太过复杂,特别是对于多元件系统 更是如此。

M. Koike 在关于 XUV 光栅仪器优化设计^[3] 中,定义了基于像差均方差的评价函数。但无法得 到像差解析表达式,特别是对于多元件系统^[4]。因 此,他只能先应用光线追迹,计算 9 条光线的光瞳坐 标和像坐标,通过解两组 9 个线性联立方程求出 18 个像差系数,并将像差系数代入评价函数,计算其 值。利用阻尼最小二乘法,优化光学参量使评价函

基金项目:国家自然科学基金(10775095)和上海市教委创新基金(08YZ14)资助课题。

作者简介:徐 挺(1984—),男,硕士研究生,主要从事 XUV 光学仪器的优化设计等方面的研究。

E-mail: pinpin@shu.edu.cn

导师简介:吕丽军(1963—),男,教授,博士生导师,主要从事 XUV 光学及仪器技术等方面的研究。 E-mail: lulijun@shu, edu, cn(通信联系人)

收稿日期: 2009-09-24; 收到修改稿日期: 2010-01-07

数值达到最小。

最近,吕丽军基于波像差的方法发展了一般的 平面对称光学系统的像差理论^[5~7]。其中的一套像 差表达式是精确的,而且比光线追迹解析法简洁得 多,适用于多元件光学系统的像差计算。本文的主 要思想就是将该像差理论应用到 M. Koike 定义的 光栅仪器评价函数,它的一个突出优点是可以直接 得到评价函数关于光学系统参量的解析表达式,无 疑这对优化过程和结果都更为有利。应用合作型协 同进化遗传算法发展了优化设计程序。并利用该程 序对 XUV 摄谱仪系统的 6 个光学系统参量进行优 化设计,应用光线追迹程序 Shadow^[8] 对光学系统进 行成像计算,并和文献[9]中的设计相比较。

2 评价函数

图 1 为平面对称光学系统的成像示意图。O 是 光学元件的顶点, $\chi\eta z'$ 是其顶点坐标系;xyz 表示光 线孔径坐标系,其原点在 P 处。 O_0O_1 位于对称平 面 $\chi Oz'$ 内,它是系统的基光线; S_0PS_1 是点光源 S_0 发出的主光线;u,u'分别表示物方和像方的视场角; 入射角 α 和衍射角 β 在对称平面内定义。

具有平面对称的面形方程一般可用如下方程 表示

$$z = c_{2,0}x^{2} + c_{0,2}y^{2} + c_{3,0}x^{3} + c_{1,2}xy^{2} + c_{4,0}x^{4} + c_{0,4}y^{4} + c_{2,2}x^{2}y^{2}, (1)$$

式中 $c_{i,j}$ 是光学元件的面形系数。



图 1 平面对称光学系统光线示意图

Fig. 1 Optical scheme of a plane-symmetric optical system

图 2 是主光线和孔径光线在弧矢平面内的示意 图,O₀和O₁分别是入、出射光瞳的中心,在关于折射 光学的参考文献和书籍中,一般用γ,t表示物方视 场角和入瞳位置。对于平面对称光学系统,用 u 表 示物方视场角更方便,并且定义一个非物理参量 l 来表示入瞳的位置:

$$O\overline{P} = \gamma t = ul. \tag{2}$$

由图 2 可知,γ,t 和 u,l(带撇表示对应的像方空间 参量)之间的关系为

$$\gamma = \left(\frac{l}{r_s} - 1\right)u = -\Lambda_1 u, \quad l = \frac{r_s t}{t - r_s}, \quad (3)$$
$$\gamma' = \left(\frac{l'}{r'_s} - 1\right)u' = \\\left(1 - \frac{l'}{r'_s}\right)u = \Lambda_1' u, \quad l' = \frac{r'_s t'}{t' - r'_s}. \quad (4)$$

式中 $\Lambda'_1 = 1 - l/r_s$, $\Lambda'_1 = 1 - l'/r_s$.





Fig. 2 Optical scheme of main light and aperture light on sagittal plane

光学系统的波像差表达式[5]为

$$W = \sum_{ijk}^{4} w_{ijk} x^{i} y^{j} u^{k}, \quad (i+j+k \leqslant 4), \quad (5)$$

式中

$$w_{ijk} = M_{ijk} (\alpha, r_{\rm m}, r_{\rm s}, l) + (-1)^{k} M_{ijk} (\beta, r'_{\rm m}, r'_{\rm s}, l') + \Lambda N_{ijk}.$$
(6)

式中 $\Lambda = (m\lambda/\sigma)\Gamma$,m为光栅级次, σ 为光栅常量, λ 为工作波长。 N_{ijk} 是与光栅刻槽系数 n_{ij} 相关的系数, M_{ijk} 是物方光束的波像差系数,它们分别由文献 [5]中的表1及(78)~(93)式给出。 M_{ijk} 中 r_m, r_s , r'_m, r'_s 分别为物方和像方空间的子午和弧矢焦距; $l'=-l_o$ 对于变线距机刻光栅与全息光栅, Γ 和 n_{ijk} 由参考文献[2]中的(20)~(22)式给出。

对于与光学元件顶点 O 相距 r'₀、并垂直于基光 线 OO₁ 的像平面,三阶像差表达式^[5,6]为

$$\begin{aligned} x' &= d_{100} x + d_{200} x^2 + d_{020} y^2 + d_{300} x^3 + d_{120} x y^2 + \\ d_{002} u^2 + d_{011} y u + d_{111} x y u + d_{102} x u^2 , \end{aligned} (7) \\ y' &= h_{010} y + h_{110} x y + h_{210} x^2 y + h_{030} y^3 + h_{003} u^3 + \end{aligned}$$

$$h_{001}u + h_{101}xu + h_{201}x^{2}u + h_{021}y^{2}u + h_{012}yu^{2},$$
(8)

式中 *d_{ijk}*和 *h_{ijk}*为像差系数,具体表达式由参考文献 [5]中的(95)~(113)式给出。

对于 g 个光学成像面的光学系统,系统总的波像差是各成像面的波像差之和^[5]。在孔径光线线性 近似条件下,

$$W = \sum_{ijk}^{4} W_{ijk}^{T} x_{g}^{i} y_{g}^{j} u_{g}^{k},$$
$$W_{ijk}^{T} = \sum_{n=1}^{g-1} W_{ijk(n)} A_{n|g}^{i} B_{n|g}^{jk} + W_{ijk(g)}, \qquad (9)$$

式中 $W_{ijk(n)}$, W_{ijk}^{T} 分别是第n个成像面和系统总的 波像差系数,系数 $A_{n|g}$, $B_{n|g}$ 由下式给出,

$$\begin{aligned} A_{n|g} &= \\ \frac{r'_{m(n)}r'_{m(n+1)}\cdots r'_{m(g-1)}}{r_{m(n+1)}r_{m(n+2)}\cdots r_{m(g)}} \frac{\cos \alpha_{n+1}\cos \alpha_{n+2}\cdots\cos \alpha_{g}}{\cos \beta_{n}\cos \beta_{n+1}\cdots\cos \beta_{g-1}}, \\ B_{n|g} &= \frac{r'_{s(n)}r'_{s(n+1)}\cdots r'_{s(g-1)}}{r_{s(n+1)}r_{s(n+2)}\cdots r_{s(g)}}. \end{aligned}$$
(10)

在计算像差系数的公式中, W_{ijk} 用 W^T_{ijk} 代替, 其它

$$Q_{y}(\lambda_{i}) = \frac{1}{DLU} \int_{-D/2-L/2-U/2}^{D/2} \int_{-D/2-L/2-U/2}^{U/2} y'^{2} dx dy du, \qquad (13)$$

式中 λ_i 为仪器的某个工作波长,D和L分别是入瞳 在光学元件坐标系x和y方向上的宽度,U为物方 视场全角。 $-D/2 \le x \le D/2$, $-L/2 \le y \le L/2$, $-U/2 \le u \le U/2$ 。 μ 为x和y方向成像质量的相 对权重因子。在(12)式中

$$\overline{x}' = \frac{1}{DLU} \int_{-D/2-L/2}^{D/2} \int_{U/2}^{L/2} \int_{U/2}^{U/2} x' dx dy du.$$
(14)

将(7)式、(8)式和(14)式代人(12)式、(13)式,
 Q_x(λ_i)和*Q_y*(λ_i)的表达式为

$$\frac{U^{2}L^{2}h_{001}h_{021} + U^{2}L^{2}h_{010}h_{012} + U^{2}D^{2}h_{001}h_{201} + D^{2}L^{2}h_{010}h_{210}}{72} + \frac{U^{2}h_{001}^{2} + L^{2}h_{010}^{2} + L^{2}h_{010}^{2}}{12} + \frac{D^{2}U^{2}L^{2}h_{012}h_{210} + D^{2}U^{2}L^{2}h_{201}h_{021}}{864} + \frac{U^{2}D^{2}h_{101}^{2} + L^{2}D^{2}h_{110}^{2}}{144}.$$
(16)

假如要优化在某个工作波段内光谱仪的成像性能, 一般要选该波段范围内的几个波长同时进行优化, 评价函数的最终表达式为

$$Q = \sum_{i} \varepsilon(\lambda_i) Q(\lambda_i), \qquad (17)$$

式中 $\epsilon(\lambda_i)$ 为各波长处成像质量的权重因子。

3 多变量函数的优化算法

由于(17)式给出的评价函数是关于多个光学系 统参量组成的复杂函数,利用遗传算法来解决它的 优化问题。针对传统遗传算法在处理多极值复杂函 数优化时易出现过早收敛的问题,采用合作型协同 进化遗传算法[10,11]。

一般优化问题都应该有目标函数 $y = Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$,其解向量为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。本文的目标函数就是(17)式,解向量就是需要优化的光学参量的集合。在光学系统设计中,精度要求一般较高,特别是对相关的角度参量。如果想保持较大的搜索范围,将参量精度一次性设为所要求的精度,会使搜索运算次数过大,导致很长的计算时间。所以提出分阶段搜索,逐步缩小参量的搜索范围和提高精度。另外,由于算法本身在搜索最优值时存在偏差,往往会随机收敛在最优值附近的某个值,采取每阶段搜索 m 次以确定最优值的分布范围,从而确

定下阶段的搜索范围。很显然 m 值越大,结果的可 靠性越高。

根据上面的思想,发展了优化设计程序,其流程 如图 3 所示。其中 0<ξ≪1,一般 m 次数越大,ξ 取 值可以相应越小。另外,为防止 x_i 在变化时溢出其 搜索范围,*x_i* 在范围内的取值个数应正好等于 2^{*k_i*} (*k_i* 为*x_i* 转化成二进制编码的位数)。所以在设置 *x_{imin}和 x_{imax}时*,它们须满足

$$\frac{x_{i\max} - x_{i\min}}{\Delta x_i^{(t)}} + 1 = 2^{k_i}, \qquad (18)$$



图 3 应用遗传算法优化光学评价函数的程序流程图

Fig. 3 Program flow diagram of optimizing the merit function with the genetic algorithm

4 数值验证

将(17)式给出的评价函数及上述的优化算法, 对参考文献[9]中的 XUV 平场摄谱仪进行优化设 计,并和该文献中原来的优化结果进行成像比较。 摄谱仪光学系统如图 4 所示,由一块前置聚焦超环 面镜和一块超环面全息光栅组成,摄谱仪的工作波 段:3~6 nm。



图 4 XUV 摄谱仪的光学系统示意图

Fig. 4 Optical scheme of the XUV spectrograph 优化过程中所采用的摄谱仪系统的总体参数及 光源的接收等和原文献中的一样,如表1所示。程 序需要优化的光学参数包括超环面反射镜的弧矢半径 ρ_1 、超环面光栅的子午和弧矢曲率半径 R_2 , ρ_2 ,以及光栅的全息记录参数 r_c , r_d , δ , γ 。有效光栅常数 $\sigma=1/f$,它和全息角度记录参数 δ , γ 之间的关系为

$$\sigma = \frac{\lambda_0}{\sin \delta - \sin \gamma},\tag{19}$$

因此,需要优化的全息记录参数实际上就是 3 个: r_c,r_d,δ;整个系统共需要优化 6 个参数。

和文献[8]中一样,选择 3,4.4,6 nm 为评价函数(17)式中的优化波长;取 4.4 nm 处的权重因子为 2,另外两个波长处为 1,那么(17)式可表示成

 $Q = Q(\lambda_1) + 2Q(\lambda_2) + Q(\lambda_3).$ (20)

根据上面的讨论,分3阶段搜索最优参量解,这 3阶段的角度参量 δ 精度依次设置为 0.1,0.01, 0.001,其余长度参量的精度依次设置为 1,0.1, 0.01。每一阶段搜索 m=10 次。其中取 $\xi=0.5$ 。 各优化参量搜索范围的初值如表 2 中所示,后两个 阶段的参量范围按上一节中的公式确定,最终优化 结果与文献[9]的优化结果同列在表 2 中。由表 2 可知, δ =80.239°,根据(19)式得到 γ =45.297°。与表 2 中的两组优化结果所对应(20)式的评价函数 Q 值分别为 Q_1 = 4.45×10⁻³(本文), Q_2 = 1.596×10⁻²(文献[9])。

应用光线追迹程序 Shadow,针对两组参数的 优化结果,对摄谱仪系统做光线追迹数值模拟。计 算的工作波长分别为 3,4.4 和 6 nm,其它参数由 表 1和 2 给出,其结果如图 5 所示。

表1 XUV 摄谱仪 第	系统的总体参数
--------------	---------

Table 1 Farameters of AUV spectrograph layou	Table 1	Parameters	of XUV	spectrograph	layout
--	---------	------------	--------	--------------	--------

Parameter	Value	Parameter	Value
α /(°)	- 88	areas of entrance pupil of toroidal mirror $/nm^{2}$	12.9×1.8
$\theta / (°)$	-86	Optimized wavelength /mm	3,4.4,6
r_0 /mm	358.39	Recording wavelength λ_0/nm	457.93
$r_{ m ml}^\prime / m mm$	180	Spectrum order m	-1
$r_{ m m2}/ m mm$	34. 9	Groove density $f / (lp/mm)$	600
r_0' /mm	1000	β /(°)	86.0221,85.3800,84.7412
$R_{ m o}/ m mm$	3430.98		

表 2 XUV 摄谱仪参量优化结果	
-------------------	--

Γał	ole 2	Parameters	optimized	of	XU	V	spectrograp	h
-----	-------	------------	-----------	----	----	---	-------------	---

System parameters	$ ho_1/ m mm$	R_2/mm	$ ho_2/\mathrm{mm}$	$r_{ m c}/ m mm$	$r_{\rm d}/{ m mm}$	δ/(°)
Initial searching range	$10\!\sim\!137$	$500\!\sim\!8691$	$10\!\sim\!4105$	$0\!\sim\!131071$	$0\!\sim\!131071$	$-46 \sim 90$
Results of this paper	53.23	2346.07	81.36	∞	50.53	80.239
Results of the reference $[9]$	42.74	2057.29	235.07	70.38	62.17	9.905





Fig. 5 Ray tracing results of XUV spectrograph. (a1), (b1) and (c1) are from this paper; (a2), (b2) and (c2) are from the reference [8]

5 讨 论

1)将吕丽军的像差理论应用于 M. Koike 定义 的评价函数,提供了一种优化 XUV 多元件光学系 统的方法,实现在基本确定光学系统结构和满足一 定约束条件下,对相关光学参量进化优化设计。根 据图 5 中的计算结果,应用本文发表的评价函数的 优化设计,其像面上的像差分布在子午(色散)和弧 失方向都比文献[9]中的优化结果小了一倍,提高了 仪器的光谱分辨率和光束强度。

2)应用遗传算法解决多参量优化问题是有效的;但要注意其收敛问题,常采用的判据为连续几次得到的最优参量值没有变化或变化很小^[9]。另外, 在得到结果后,必须应用光线追迹手段,对光学系统 进行精确的成像计算。如果性能和预期的不一致或 不能满足设计要求,应该调整算法中的相关参量,进 行多次优化计算。

6 结 论

研究结果表明,利用本文介绍的方法得到的光 学系统的成像性能,比文献[9]中的结果要好。光线 在 *x* 和 *y* 方向上产生的像差分别减小近1倍。另 外,通过改变权重因子 μ 的值,评价函数能调整 *x* 和 *y* 方向成像质量的相对重要性,而后者所应用的 评价函数^[9]却不能。所以,本文发展的评价函数在 XUV 多元件光栅光学系统优化设计中是十分有效。

参考文献

- 1 H. Noda, T. Nomioka, M. Seya. Geometric theory of the grating [J]. Opt. Soc. Am., 1974, 64(8): 1031~1036
- 2 T. Nomioka, M. Koike, D. Content. Geometric theory of the ellipsoidal grating [J]. Appl. Opt., 1994, **33**(31): 7261~7274
- 3 M. Koike, T. Namioka. Merit function for the design of grating instruments [J]. Appl. Opt., 1994, 33(10): 2048~2056
- 4 M. Koike, Y. Ueno, T. Namioke. Application of the hybrid design method to VUV double-element optical systems equipped with holographic gratings recorded with aspheric wave fronts [J]. SPIE, 1997, **3150**: 31~39
- 5 L. J. Lu. Aberration theory of plane-symmetric grating systems [J]. Synchrotron Rad, 2008, 15(4): 399~410
- 6 L. J. Lu, D. L. Lin. Aberrations of plane-symmetric multielement optical systems [J]. Opt. Int. J. Light Electron. Opt., 2009(in press)
- 7 L. J. Lu, Z. Y. Deng. Geometric characteristics of aberrations of plane-symmetric optical systems [J]. Appl. Opt., 2009, 48(36): 6946~6960
- 8 B. Lai, F. Cerrina. SHADOW: A synchrotron radiation tracing program [J]. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 1986,

246(2): 337~342

- 9 M. P. Chrisp. X-ray spectrograph designs [J]. Appl. Opt., 1983, 22(10): 1519~1529
- 10 Liu Guohua, Bao Hong, Li Wenchao. A genetic algorithm in MATLAB [J]. Computer applied research, 2001, 18(08): 80~82

刘国华,包 宏,李文超.用 MATLAB 实现遗传算法程序 [J]. 计算机应用研究,2001,**18**(08):80~82

11 Gong Dunwei, Sun Xiaoyan. The theory and application of coevolution genetic algorithm [M]. Beijin: Science Press, 2009. 6~12

巩敦卫,孙晓燕.协同进化遗传算法理论及应用 [M].北京:科学出版社,2009,6~12

12 Lü Lijun. Study of ultraviolet and soft X-ray varied-line-space plane grating monochromator [J]. Acta Optica Sinica, 2005, 25(1): 141~144
吕丽军.极紫外、软 X 射线变线距平面光栅单色仪的研究 [J].

光学学报, 2005, **25**(1): 141~144 13 Zhao Jinsong, Li Lifeng, Wu Zhenhua. In-Situ self-monitoring of latent image in fabrication of holographic gratings [J]. Acta Optica Sinica, 2004, **24**(6): 851~858

赵劲松,李立峰,吴振华. 全息光栅制作中的实时潜像自监测技术 [J]. 光学学报, 2004, **24**(6): 851~858

- 14 Zhao Jinsong, Li Lifeng, Wu Zhenhua. Modeling of in-situ monitoring curves during development of holographic gratings [J]. Acta Optica Sinica, 2004, 24(8): 1146~1150 赵劲松,李立峰,吴振华. 全息光栅实时显影监测曲线的理论模拟 [J]. 光学学报, 2004, 24(8): 1146~1150
- 15 Tang Bin, Tao Shiquan, Yan Xingchang *et al.*. Study on signal-to-noise ratio of retrieved from volume holographic memories [J]. *Chinese J. Lasers*, 1999, A26(3): 273~278
 唐 斌, 陶世荃,杨兴昌等. 体全息存储图像的信噪比研究

[J]. 中国激光, 1999, A**26**(3): 273~278

16 Wang Zihua. An improved Rouard's method for grating analysis
[J]. Acta Optica Sinica, 2001, 21(5): 605~608
王子华. 计算光栅的一个改进的 Rouard 方法 [J]. 光学学报, 2001, 21(5): 605~608